

岩矿鉴定报告单

薄片号：WGTJ5-1

野外名称：无。

采样地点：文化—郭家坝。

显微镜下薄片鉴定描述：

变余硅泥质粉砂状结构。

岩石由粉砂、硅质矿物、浅变质泥质等组成。

粉砂(50%)：形状多为棱角状、次棱角状，磨圆度差；粒度多小于 0.05(mm)、为粉砂（40%），少量者为 0.05—0.10（mm）、为较细的细砂（10%）；成分种类为石英（40%）、硅质岩（5%）、斜长石+少量钾长石（1%）、少白云母碎片+少量蚀变黑云母碎片（2.5%）、褐铁矿化磁铁矿（1.5%）、电气石（微量）。

硅质矿物（25%）：微晶、隐晶状；粒度多小于 0.005（mm），少量者为 0.005—0.01（mm）；主要为隐晶、微晶石英，可能含蛋白石等，为原生沉积硅质矿物的浅变质重结晶产物；不均匀分布于浅变质泥质集合体中，其团块状集合体极像硅质岩粉砂、细砂。

浅变质泥质（25%）：原岩泥质经浅变质结晶为泥状、显微鳞片状绢云母和泥状绿帘石等，与硅质矿物一起成为粉砂、细砂的基底；绿帘石多风化褐铁矿化，使岩石略显浅褐色。

原岩胶结物：硅质、泥质。

原岩胶结类型：基底式。

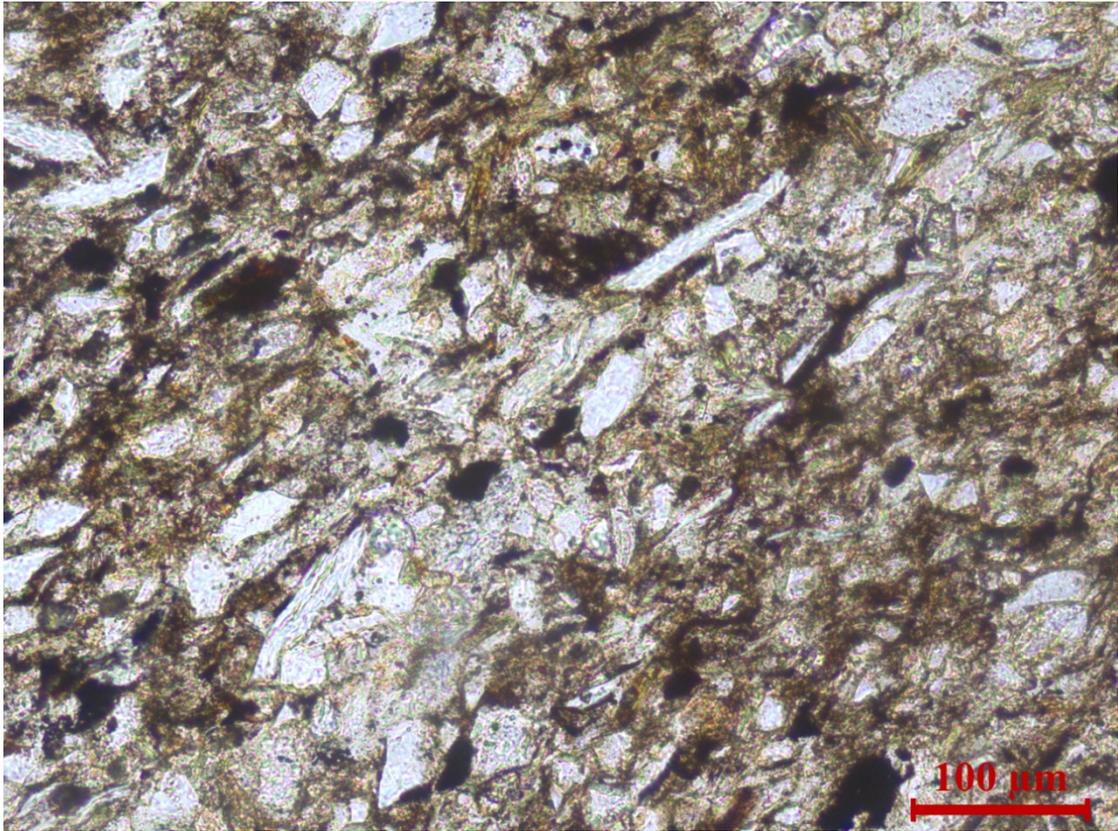
原岩：硅泥质粉砂岩。

变质、蚀变：低级区域变质。

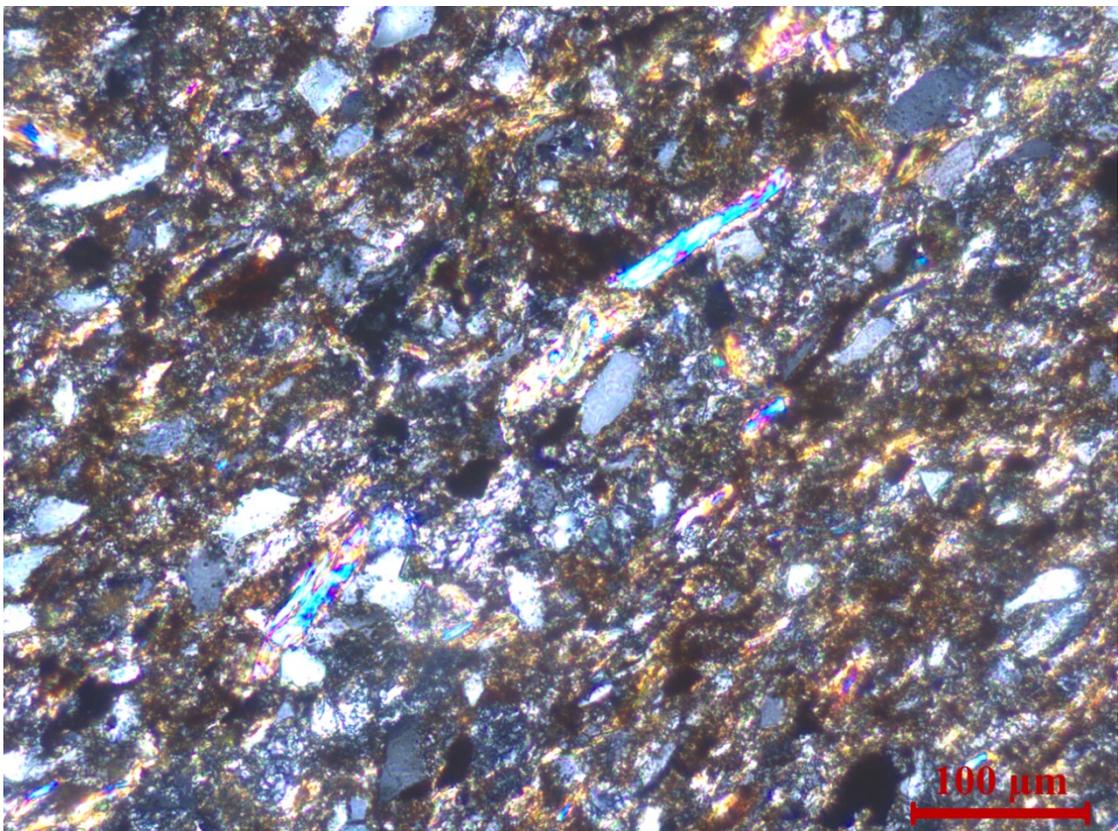
显微镜下鉴定命名：浅变质硅泥质粉砂岩。

鉴定人：曾广策

鉴定日期：2019年6月29日



17-1, WGTJ5-1, 浅变质硅泥质粉砂岩。单偏光。



17-2, WGTJ5-1, 浅变质硅泥质粉砂岩。正交偏光。